

全反射红外逐层检测含重氮高分子薄膜的生长

廖玮; 魏芳; 曹维孝; 赵新生

北京大学分子动态与稳态结构国家重点实验室; 化学与分子工程学院化学生物学系;

摘要:

运用全反射红外技术对逐层组装的含重氮高分子薄膜进行了分步定量分析. 利用 $-CH_2-$ 峰的逐层变化规律, 确认了在组装过程中每层吸附高分子的量是一致的. 通过重氮基 $-N=N+$ 特征的吸收峰, 定量计算了在特定实验条件下, $-N=N+$ 分解生成共价键的比例. 这些结果为认识重氮高分子薄膜的生长提供了更为直接和细致的信息.

关键词: 全反射红外 高分子 重氮 薄膜 硅

收稿日期 2003-10-31 修回日期 2003-12-16 网络版发布日期 2004-04-15

通讯作者: 赵新生 Email: zhaoxs@chem.pku.edu.cn

本刊中的类似文章

扩展功能

本文信息

[PDF\(1651KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [全反射红外](#)

▶ [高分子](#)

▶ [重氮](#)

▶ [薄膜](#)

▶ [硅](#)

本文作者相关文章

▶ [廖玮](#)

▶ [魏芳](#)

▶ [曹维孝](#)

▶ [赵新生](#)